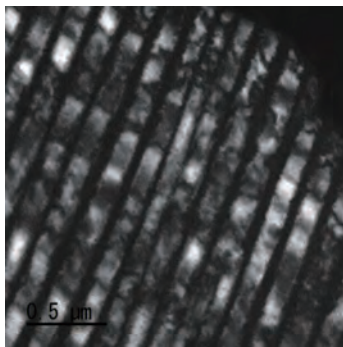
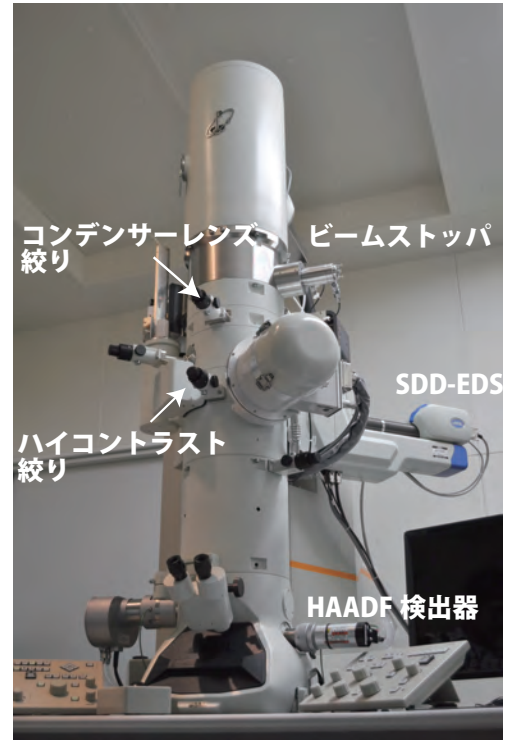
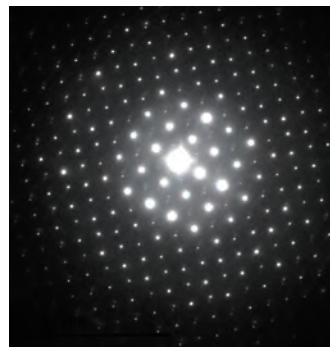


JEM-2100F

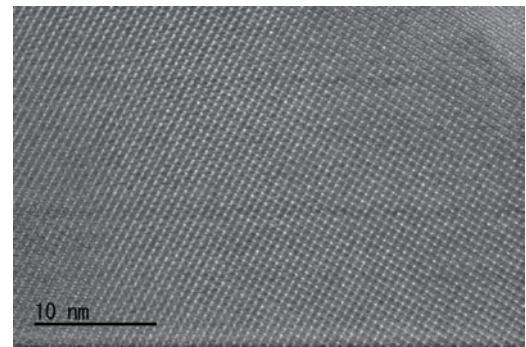
電界放出形電子顕微鏡
日本電子株式会社 JEOL



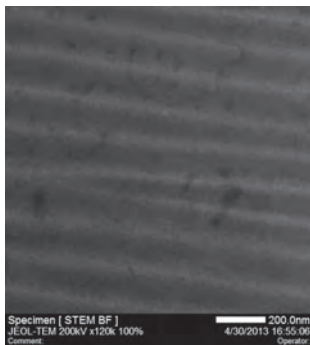
暗視野像



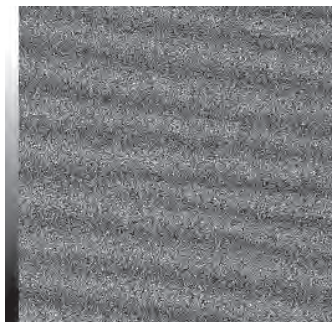
電子回折像



高分解能像



STEM-ABF 像



EDS-mapping (Ca)



EDS-mapping (Na)



STEM-ABF 像 (高分解能)

基本スペック

型式	JEM-2100F (JEOL)
ポールピース	HRP
加速電圧	100, 120, 160, 200kV
電子銃	フィールドエミッション銃
EDS	JED-2300T AnalysisStation (JEOL; SDD, 100mm ² , 0.98sr)
サイド CCD	ORIU200D (Gatan; 2k × 2k)
ボトム CCD	ORIU1000 (Gatan; 4k × 2k)

その他

- TEM 像 (明・暗視野像 / 高分解能像)
- STEM 像 (HAADF/ABF/BF 像*)
- 収束電子回折
- TEM/STEM トモグラフィー
- 試料ホルダー
 - Be2 軸傾斜ホルダー
 - 1軸傾斜ホルダー
 - トモグラフィ用高傾斜 1軸ホルダー

試料 (全て): ラブラドライト

連絡先:
miya @ kueps.kyoto-u.ac.jp